

Ш. ФИРКОВИЧ
(Варшава, ПНР)

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ*

Оценку качества изделий мы называем статистической, если она основана на анализе результатов испытаний случайной выборки. Вполне понятно, что такая оценка применима лишь для изделий массового производства.

В работе рассмотрен вопрос численной статистической оценки качества изделий:

а) путем сравнения результатов испытаний случайной выборки с требованиями, установленными для учитываемых свойств изделий; такую оценку будем называть коэффициентом качества и обозначать Q ;

б) путем сравнения отдельных свойств изделий оцениваемой совокупности со свойствами изделий установленной стандартной совокупности на основе результатов испытаний случайных выборок из этих совокупностей; такую оценку будем называть коэффициентом относительно качества и обозначать Q^* .

Величины Q и Q^* могут быть вычислены для любого множества свойств рассматриваемых изделий, но схема испытаний и анализа их результатов должна быть заранее установлена.

Испытание B , вероятностным отображением которого является одномерная случайная величина X с дискретным или непрерывным распределением, назовем элементарным испытанием, а коэффициенты $Q(B) = q$ и $Q^*(B) = q^*$ — элементарными коэффициентами качества. Элементарные коэффициенты q и q^* являются основой вычисления величин Q и Q^* для учитываемого множества свойств оцениваемых изделий.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КАЧЕСТВА q

С элементарным испытанием B сопряжена одномерная случайная величина X . Показателем качества изделий, с точки зрения испытания B , является определенный параметр ξ распределения случайной величины X в данной совокупности изделий; это может быть доля брака (при учете данного множества качественных признаков), среднее значение количественного признака, интенсивность отказов и т. п. Обычно требование дается в виде неравенства $\xi \geq \xi_0$ или $\xi \leq \xi_0$, где ξ_0 — требуемое значение величины ξ . Задача заключается в вычислении элементарного ко-

* Материал доложен на VIII Всесоюзной конференции по автоматическому контролю и методам электрических измерений в сентябре 1966 года в Новосибирске.

ээффициента качества q , если требование известно и если знаем не величину ξ , а только ее оценку ξ^* из проведенного испытания B случайной выборки установленного объекта n .

Для простоты и общности рассуждений введем следующие обозначения: $\{\xi^* > \xi_0\} \equiv \{\text{при } \xi = \xi^* \text{ изделия считаем лучшими, чем при } \xi = \xi_0\}$, $\{\xi^* < \xi\} \equiv \{\text{при } \xi = \xi_0 \text{ изделия считаем лучшими, чем при } \xi = \xi^*\}$.

Коэффициент q должен удовлетворять следующим условиям:

$$\begin{aligned} \xi^* < \xi_0 &\longleftrightarrow 0 \leq q < 1; \\ \xi^* = \xi_0 &\longleftrightarrow q = 1; \\ \xi^* > \xi_0 &\longleftrightarrow 1 < q \leq 2. \end{aligned} \quad (1)$$

Исходя из этих условий, получаем формулу

$$q = \begin{cases} 1 - \gamma_1, & \text{если } \xi^* < \xi_0; \\ 1, & \text{если } \xi^* = \xi_0; \\ 1 + \gamma_2, & \text{если } \xi^* > \xi_0, \end{cases} \quad (2)$$

где $0 \leq \gamma_1 \leq 1$; $0 \leq \gamma_2 \leq 1$.

Для вычисления величин γ_1 и γ_2 надо помнить, что ξ^* является значением определенной статистики $\hat{\xi}$, причем распределение статистики $\hat{\xi}$ зависит от величины ξ .

Полагая $\xi = \xi_0$, для вычисления величин γ_1 и γ_2 используем статистику $U = \varphi(\hat{\xi}, \xi_0; \xi = \xi_0)$ с известным распределением, причем

- а) $\varphi(\xi^*, \xi; \xi = \xi_0) = u$;
- б) если $\xi^* = \xi_0$, то $u = u_0$;
- в) всегда $u_1 \leq u \leq u_2$.

Если статистика $U = \varphi(\hat{\xi}, \xi; \xi = \xi_0)$ удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} \{\xi^* < \xi_0\} &\equiv \{u_0 < U \leq u_2\}; \\ \{\xi^* > \xi_0\} &\equiv \{u_1 \leq U < u_0\}, \end{aligned} \quad (3)$$

то γ_1 и γ_2 вычисляются по формулам:

$$\gamma_1 = P\{u_0 < U \leq u \mid u_0 < U \leq u_2\} = \frac{P\{u_0 < U \leq u\}}{P\{u_0 < U \leq u_2\}}; \quad (4)$$

$$\gamma_2 = P\{u \leq U < u_0 \mid u_1 \leq U < u_0\} = \frac{P\{u \leq U < u_0\}}{P\{u_1 \leq U < u_0\}}, \quad (5)$$

а если статистика U удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} \{\xi^* < \xi_0\} &\equiv \{u_1 \leq U < u_0\} \\ \text{и} \\ \{\xi^* > \xi_0\} &\equiv \{u_0 < U \leq u_2\}, \end{aligned} \quad (6)$$

то формулы для γ_1 и γ_2 следует поменять местами и вычислять γ_1 по формуле (5), а γ_2 по формуле (4).

Если статистика U распределена симметрично относительно величины u_0 , то можно пользоваться статистикой

$$V = U - u_0, \quad (7)$$

распределенной симметрично относительно нуля. Тогда

$$\begin{aligned} v &= u - u_0; \\ v_0 &= u_2 - u_0 = u_0 - u_1 > 0. \end{aligned} \quad (8)$$

И поэтому

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \frac{P\{|V| \leq |v|\}}{P\{|V| \leq v_0\}}. \quad (9)$$

Подбор соответствующей для данного случая статистики U или V довольно прост и показан на практических примерах в работах [1, 2].

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА КАЧЕСТВА q^*

Значение показателя качества ξ в оцениваемой совокупности изделий обозначим ξ_1 , а в стандартной совокупности ξ_2 . Задача заключается в вычислении элементарного коэффициента качества q^* , если известна оценка ξ_1^* величины ξ_1 и оценка ξ_2^* величины ξ_2 из проведенного испытания B случайных выборок n_1 изделий из оцениваемой совокупности и n_2 изделий из стандартной совокупности, причем n_1 и n_2 заранее установлены.

Коэффициент q^* должен удовлетворять следующим условиям:

$$\begin{aligned} \xi_1^* < \xi_2^* &\leftrightarrow 0 \leq q^* < 1; \\ \xi_1^* = \xi_2^* &\leftrightarrow q^* = 1; \\ \xi_1^* > \xi_2^* &\leftrightarrow 1 < q^* \leq 2. \end{aligned} \quad (10)$$

Исходя из этих условий, получаем

$$q^* = \begin{cases} 1 - \beta_1, & \text{если } \xi_1^* < \xi_2^*; \\ 1, & \text{если } \xi_1^* = \xi_2^*; \\ 1 + \beta_2, & \text{если } \xi_1^* > \xi_2^*, \end{cases} \quad (11)$$

где

$$0 \leq \beta_1 \leq 1; \quad 0 \leq \beta_2 \leq 1.$$

Оценки ξ_1^* и ξ_2^* являются как, известно, значениями статистик $\hat{\xi}_1$ и $\hat{\xi}_2$. Для вычисления величин β_1 и β_2 используем статистику $U^* = \psi(\hat{\xi}_1, \hat{\xi}_2; \xi_1 = \xi_2)$ с известным распределением, причем

- а) $\psi(\hat{\xi}_1^*, \hat{\xi}_2^*; \xi_1 = \xi_2) = u^*$;
- б) если $\xi_1^* = \xi_2^*$, то $u^* = u_0$;
- в) всегда $u_1^* \leq u^* \leq u_2^*$.

Если статистика $U^* = \psi(\xi_1, \xi_2; \xi_1 = \xi_2)$ удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} & \{\xi_1^* < \xi_2^*\} \equiv \{u_0^* < U^* \leq u_2^*\} \\ \text{и} & \{\xi_1^* > \xi_2^*\} \equiv \{u_1^* \leq U^* < u_0^*\}, \end{aligned} \quad (12)$$

то β_1 и β_2 вычисляются по формулам:

$$\beta_1 = P\{u_0^* < U^* \leq u_2^* | u_0^* < U^* \leq u_2^*\} = \frac{P\{u_0^* < U^* \leq u_2^*\}}{P\{u_0^* < U^* < u_2^*\}}; \quad (13)$$

$$\beta_2 = P\{u_1^* \leq U^* < u_0^* | u_1^* \leq U^* < u_0^*\} = \frac{P\{u_1^* \leq U^* < u_0^*\}}{P\{u_1^* < U^* < u_0^*\}}; \quad (14)$$

если статистика U^* удовлетворяет условиям

$$\begin{aligned} & \{\xi_1^* < \xi_2^*\} \equiv \{u_1^* \leq U^* < u_0^*\} \\ \text{и} & \{\xi_1^* > \xi_2^*\} \equiv \{u_0^* < U^* \leq u_2^*\}, \end{aligned} \quad (15)$$

то формулы для β_1 и β_2 следует поменять местами и вычислять β_1 по формуле (14), а β_2 по формуле (13).

В случае симметрии статистики U^* относительно величины можно пользоваться статистикой

$$V^* = U^* - u_0^*, \quad (16)$$

распределенной симметрично относительно нуля.

Тогда

$$\begin{aligned} v^* &= u^* - u_0^*; \\ v_0^* &= u_2^* - u_0^* = u_0^* - u_1^* > 0. \end{aligned} \quad (17)$$

И поэтому

$$\beta_1 = \beta_2 = \frac{P\{|V^*| \leq |v^*|\}}{P\{|V^*| \leq v_0^*\}}. \quad (18)$$

Подбор статистики U^* и V^* показан на практических примерах в работах [3, 4].

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ ПРИ УЧЕТЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО МНОЖЕСТВА ИХ СВОЙСТВ

Предположим, что установленная схема испытаний учитывает множество испытаний Ω , состоящее из $m \geq 1$ непересекающихся групп испытаний, а каждая группа испытаний $\Omega_i \subset \Omega$ состоит из $m_i \geq 1$ взаимно независимых элементарных испытаний $B_{ij} \in \Omega_i$.

Под взаимной независимостью испытаний $B_{ij} \in \Omega_i$ подразумевается, что проведение одного испытания не влияет на результат друго-

го, для чего иногда достаточно установить определенную очередность испытаний, а иногда надо провести испытания на отдельных выборках. Предположим дальше, что для испытаний $B_{ij} \in \Omega$ установлены весовые коэффициенты $b_{ij} > 0$, а для групп испытаний $\Omega_i \subset \Omega$ — весовые коэффициенты $b_i > 0$. Наша задача может быть сведена к одной из двух следующих: а) вычислить коэффициент качества $Q = Q(\Omega)$, если известны величины $q_{ij} = Q(B_{ij})$ для всех элементарных испытаний $B_{ij} \in \Omega$ или б) вычислить коэффициент относительного качества $Q^* = Q^*(\Omega)$, если известны величины $q_{ij}^* = Q^*(B_{ij})$ для всех элементарных испытаний $B_{ij} \in \Omega$.

Ввиду того, что для решения этих задач можно использовать однотипные формулы, рассмотрим только следующие зависимости:

$$Q = Q(\Omega) = F(Q_i, b_i) \quad (i = 1, 2, \dots, m), \quad (19)$$

где

$$Q_i = Q(\Omega_i) = F_i(q_{ij}, b_{ij}) \quad (j = 1, 2, \dots, m), \quad (20)$$

причем предел возможных значений величин Q_i и Q такой же, как и у q_{ij} , т. е.

$$0 \leq Q_i \leq 2 \quad \text{и} \quad 0 \leq Q \leq 2. \quad (21)$$

Предположим, что группа Ω_i может состоять из непересекающихся подгрупп Ω_{iA} и Ω_{iB} , характерных тем, что

$$\bigvee_{B_{ij} \in \Omega_{iA}} q_{ij} = 0 \leftrightarrow Q_i = 0; \quad (22)$$

$$\bigwedge_{B_{ij} \in \Omega_{iB}} q_{ij} = 0 \leftrightarrow Q_i = 0, \quad (23)$$

причем принадлежность испытания B_{ij} к подгруппе Ω_{iA} или Ω_{iB} установлена заранее. Из условий (22) и (23) следует, что подгруппа Ω_{iB} равносильна элементарному испытанию с весовым коэффициентом

$$b_{iB} = \max_{B_{ij} \in \Omega_{iB}} b_{ij}. \quad (24)$$

Исходя из этих предположений и учитывая, что

$$\bigwedge_{B_{ij} \in \Omega_i} q_{ij} = 1 \rightarrow Q_i = 1 \quad (25)$$

и

$$\bigwedge_{B_{ij} \in \Omega_i} q_{ij} = 2 \leftrightarrow Q_i = 2, \quad (26)$$

получим

$$\lg Q_i = \frac{b_{iB} \lg Q_{iB} + \sum_{B_{ij} \in \Omega_{iA}} b_{ij} \lg q_{ij}}{b_{iB} + \sum_{B_{ij} \in \Omega_{iA}} b_{ij}}, \quad (27)$$

где

$$Q_{iB} = \frac{\sum_{B_{ij} \in \Omega_{iB}} b_{ij} q_{ij}}{\sum_{B_{ij} \in \Omega_{iB}} b_{ij}}. \quad (28)$$

Если все испытания $B_{ij} \in \Omega_i$ принадлежат к подгруппе Ω_{iA} , то

$$\lg Q_i = \frac{\sum_{B_{ij} \in \Omega_i} b_{ij} \lg q_{ij}}{\sum_{B_{ij} \in \Omega_i} b_{ij}}, \quad (29)$$

а если все испытания $B_{ij} \in \Omega_i$ принадлежат к подгруппе Ω_{iB} , то $Q_i = Q_{iB}$ и вычисляется по формуле (28).

Рассмотрим вопрос вычисления коэффициента качества $Q = Q(\Omega)$, учитывающего все $m \geq 1$ непересекающихся групп $\Omega_i \subset \Omega$.

Исходя из условия (21) и учитывая, что

$$\bigwedge_{\Omega_i \subset \Omega} Q_i = 1 \rightarrow Q = 1; \quad (30)$$

$$\bigwedge_{\Omega_i \subset \Omega} Q_i = 2 \leftrightarrow Q = 2; \quad (31)$$

$$\bigvee_{\Omega_i \subset \Omega} Q_i = 0 \leftrightarrow Q = 0, \quad (32)$$

получим

$$\lg Q = \frac{\sum_{\Omega_i \subset \Omega} b_i \lg Q_i}{\sum_{\Omega_i \subset \Omega} b_i} = \frac{\sum_{i=1}^m b_i \lg Q_i}{\sum_{i=1}^m b_i}. \quad (33)$$

Для практики интересным является случай $b_i = 1$ для всех m групп $\Omega_i \subset \Omega$ и $b_{ij} = 1$ для всех $B_{ij} \in \Omega$.

Если для отдельных $\Omega_i \subset \Omega$ имеем r_i испытаний $B_{ij} \in \Omega_{iA}$ и k_i испытаний $B_{ij} \in \Omega_{iB}$, то

$$\lg Q_i = \begin{cases} \frac{1}{r_i + 1} \left[\lg Q_{iB} + \sum_{j=1}^{r_i} \lg q_{ij} \right], & \text{если } k_i \geq 1; \\ \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} \lg q_{ij}, & \text{если } k_i = 0, \end{cases} \quad (34)$$

где

$$Q_{iB} = \frac{1}{k_i} \sum_{j=r_i+1}^{r_i+k_i} q_{ij}, \quad (35)$$

а коэффициент Q вычисляется по формуле

$$\lg Q = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \lg Q_i. \quad (36)$$

Пользуясь приведенными формулами, можно также вычислить коэффициент относительного качества Q^* , если вместо величин q_{ij} подставим величины q_{ij}^* .

Примеры практического использования рассмотренного метода статистической оценки качества изделий массового производства приведены в работах [2, 3, 5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Sz. Firkowicz. Przegląd Elektroniki, 1966, № 6.
2. Sz. Firkowicz. Prace PIE, 1966, № 2.
3. Sz. Firkowicz. Prace PIE, 1965, № 3/4.
4. Sz. Firkowicz. Przegląd Elektroniki, 1966, № 9.
5. Sz. Firkowicz. Przegląd Elektroniki, 1966, № 5.

*Поступила в редакцию
19 сентября 1966 г.*